1990 7/1

https://doi.org/10.3176/oil.1990.1.07

УДК 552.58: 548.737: 539.25(234.82)

А. А. ИЕВЛЕВ, А. А. БЕЛЯЕВ

ЭЛЕКТРОННОМИКРОСКОПИЧЕСКОЕ И МИКРОДИФРАКЦИОННОЕ ИЗУЧЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА ЧЕРНЫХ СЛАНЦЕВ ПАЙ-ХОЯ

При исследовании состава и свойств органического вещества (ОВ) черных сланцев Пай-Хоя, имеющих возраст от среднего ордовика до ранней перми, термическим методом Я. Э. Юдович с соавторами установил следующее [1]: основная масса ОВ по степени катагенеза отвечает полуантрацитам-антрацитам, а меньшая его часть метаморфизована до несовершенных графитов; не наблюдается явной зависимости степени катагенеза ОВ от геологического возраста черных сланцев.

В публикуемом сообщении приводятся результаты изучения концентратов ОВ этих сланцев методами просвечивающей электронной микроскопии и микродифракции электронов.

Экспериментальная часть

Концентраты ОВ углеродистых карбонатно-кремнистого сланца нижневизейского яруса, радиолярита турнейского яруса и кремнистого сланца башкирского яруса готовили способом, описанным в [1]. Исследована также большая группа природных образований, представляющих собой черные тонкодисперсные массы — продукты физико-химического выветривания нижневизейских черных сланцев Пай-Хоя [2], обогащенные углеродистым веществом (по нашим данным, $C_{\rm opt}$ 2—27 %).

Препараты для исследования морфологии частиц готовили методом суспензии [3]. В работе использован просвечивающий электронный микроскоп «Тесла ВС-500».

Известно, что микродифракционное изучение рентгеноаморфных веществ затруднено тем, что картина рассеяния электронов препаратом является результатом наложения двух картин: рассеяния электронов исследуемыми частицами и пленкой-подложкой. По интенсивности рефлексы обеих картин сравнимы друг с другом, а кроме того, рефлексы одной картины могут накладываться на рефлексы другой. Вычленение вклада пленки-подложки из общей картины микродифракции электронов на практике представляет собой трудновыполнимую задачу. Поэтому в нашем исследовании для микродифракционного изучения готовили специальные препараты без пленки-подложки.

В результате обработки экспериментальных данных [4] была получена нормированная кривая экспериментальной интенсивности рассеяния электронов исследуемым веществом $I_n(s)$ (рис. 1). Затем была

построена функция радиального распределения атомов в изученном материале $\Phi(r)$ (рис. 2):

$$\Phi(r) = 2\pi \varrho_0 r^2 + 2r/\pi \int_{s}^{s_2} s[I_n(s)/f^2(s) - 1] \sin(sr) ds,$$

где ϱ_0 — средняя атомная плотность; r — радиус-вектор; s — вектор рассеяния; s_1 , s_2 — экспериментально установленные пределы исследования; f(s) — атомный фактор рассеяния исследуемого материала.

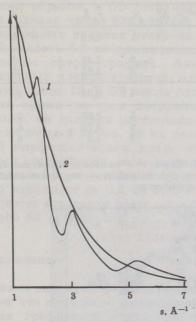


Рис. 1 Нормированная коивая экспериментальной интенсивности рассеяния электронов $I_n(s)$ (1) в ОВ черных сланцев Пай-Хоя и кривая $f^2(s)$ (2)

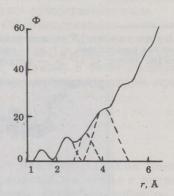


Рис. 2 График функции радиального распределения атомов $\Phi(r)$ в ОВ черных сланцев Пай-Хоя

Средняя атомная плотность определяется из выражения

$$\varrho_0 = d/m_{\rm H}M$$
,

где d — плотность исследуемого вещества; M — молекулярная масса вещества; $m_{\rm H} = 1,65 \cdot 10^{-24}$ — масса атома водорода (в граммах).

Функция радиального распределения атомов дает информацию о наиболее вероятных и средних межатомных расстояниях, числе ближайших соседей и среднеквадратичных отклонениях расстояний между атомами в исследуемом веществе.

Обсуждение результатов

ОВ черных сланцев представлено материалом, который дает три дифракционных пика (рис. 1) с максимумами при 3,37, 2,02 и 1,17 Å. Первый пик близок к рефлексу графита $d_{002}=3,35$ Å.

Сравним основные характеристики структуры исследованного материала и идеального графита (таблица). В графите атомы, которые

находятся в узлаж правильной гексагональной сетки, расположены слоями. Параметры 1-й координационной сферы исследуемого ОВ согласуются с ее параметрами для графита. Следовательно, ближайшее окружение атома такое же, как у графита. Во 2-ю координационную сферу ОВ попадают две координационные сферы графита, отве-

Структурные характеристики ОВ черных сланцев Пай-Хоя и идеального графита

ОВ				Идеальный графит			
N	r, Å	< r >, Å	m	$<\Delta r^2>$, A^2	N	r, A	m
1	1,3	1,35	2,7	0,05	1	1,42	3
2	2,3	2,41	8,1	0,1	2 3	2,45 2,83	6 3
3	3,3	3,28	8,3	0,07	4	3,34	1
4	4,1	4,15	25,9	0,2	5 6 7	3,63 3,75 4,2	9 6 6

П р и м е ч а н и е. N — номер координационной сферы, r — наиболее вероятное межатомное расстояние, < r> — среднее межатомное расстояние, m — число ближайших соседей атома, $< \Delta r^2 >$ — среднеквадратичное отклонение.

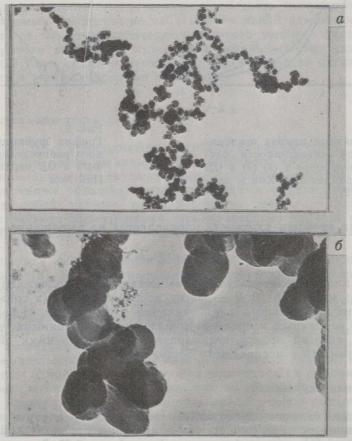


Рис. 3 Электронные микрофотографии глобулярно-цепочечных агрегатов ОВ черных сланцев Пай-Хоя: $a=21\,000\times$, $\delta=120\,000\times$

чающие за расположение вторых и третьих соседей атома в плоскости слоя. Аналогичная ситуация наблюдается у $\Phi(r)$ для аморфных пленок углерода [5, 6], которая имеет максимум при 2,48 Å и число ближайших соседей, равное девяти. Следовательно, расположение дальних соседей атома в плоскости слоя в Ol3 и в графите различное.

В идеальном графите расстояние между слоями равно 3,34 Å, число ближайших соседей равно одному. В ОВ расстояние такое же, а число соседей атома возрастает до восьми. В аморфных пленках углерода число ближайших соседей атома на этом расстоянии составляет 3—4. Таким образом, в ОВ сохраняется межслоевое «графитовое» расстояние, однако число ближайших соседей атома больше, чем в графите и аморфных пленках углерода.

В область 4-й координационной сферы ОВ попадают три координационные сферы графита. Аналогичная ситуация характерна для аморфных пленок углерода, однако у ниж число ближайших соседей атома равно 12. В ОВ число ближайших соседей составляет 26, в графите сумма по трем координационным сферам равна 21. Следовательно, на далеких расстояниях тоже более или менее «графитовое» число соседей атома, но их расположение уже существенно иное.

В морфологическом плане исследуемое ОВ представлено цепочечными постройками, состоящими из отдельных частиц, форма которых близка к сферической либо комкообразной (рис. 3a), а поперечный размер варьирует от 0,2 до 0,02 мкм. Каждая частица, в свою очередь, является агрегатом более мелких сферических частиц диаметром примерно 60 Å (рис. 36).

Заключение

Прямое исследование структуры ОВ черных сланцев Пай-Хоя показало, что его можно рассматривать как углеродный материал с зачат-ками графитовой структуры, или как смесь графитоподобного и аморфного материалов. Графитоподобное вещество с $d_{002}=3,37\,$ Å, согласно структурной классификации К. А. Лэндиса [7], может быть отнесено к достаточно структурно-упорядоченной группе d_{1A} -графитов.

Известно, что сажа, образующаяся при сгорании углеводородсодержащих соединений, имеет вид сферических сгустков диаметром от 100 до 2000 Å [8]. Они состоят из мельчайших пакетов турбостратного графита (поперечный размер пакета 20-30 Å), окруженных аморфным углеродом. Судя по структуре и морфологии ОВ черных сланцев Пай-Хоя его можно рассматривать как подобное таким сажистым образованиям: в нем есть несовершенный графит ($d_{002}=3,37$ Å) и аморфный углерод (рефлексы при 2,02 и 1,17 Å).

Заметим, что микродифракционное исследование ОВ затрудняется тем, что структура ОВ разрушается под действием пучка электронов: интенсивность рефлекса d_{002} снижается вплоть до полного исчезновения, остаются лишь два дифракционных «гало», характерных для микродифракционных картин аморфных пленок углерода. При этом контуры частиц ОВ становятся расплыв чатыми и их микроглобулярная структура исчезает. Явление аморфизации графитизированного углерода под действием электронного облучения отмечали Т. Имура и М. Дои [9].

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Юдович Я. Э., Красавина Т. Н., Беляев А. А. Органическое вещество черных сланцев Пай-Хоя и севера Урала // Горючие сланцы. 1986. Т. 3, № 2. C. 143-155.
- 2. Иевлев А. А. Эволюция гипергенного минералообразования при выветривании фосфатоносных пород в арктических условиях // Минералогенезис и рост кристаллов. Сыктывкар, 1987. С. 14-27. (Тр. Ин-та геологии Коми филиала АН СССР. Вып. 59).

3. Грицаенко Г. С., Рудницкая Е. С., Горшков А. И. Электронная микроско-

пия минералов. — М., 1961. 4. *Татаринова Л. И.* Электронография аморфных веществ. — М., 1972.

5. Полтавцев Ю. Г., Захаров В. П., Позднякова В. М. Электронографические исследования аморфных пленок углерода и бора // Кристаллография. 1973. Т. 18. Вып. 2. С. 425—426.

6. Скрышевский А. Ф. Структурный анализ жидкостей и аморфных тел. — М.,

1980.

7. Landis C. A. Graphitization of dispersed carbonaceous material in metamorphic rocks // Contrib. Mineral. Petrol. 1971. V. 30(1). P. 34-45.

8. Салли И. В., Льняной В. Н., Пясецкий И. И. Углерод на поверхности раство-

ров внедрения. — Киев, 1973.

9. Imura T., Doj M. Effects of electron irradiation on amorphous materials // Solute-Defect Interact.: Theory and Exp.: Proc. Intern. Semin. Kingston, Aug. 5—9, 1985. Toronto e. a., 1986. P. 327—334.

Институт геологии Коми научного центра Уральского отделения Академии наук СССР г. Сыктывкар

Представил А. Я. Аарна Поступила в редакцию 31,12,88

A. A. IEVLEV. A. A. BELYAEV

ORGANIC MATTER OF BLACK SHALES OF THE PAI-KHOI. ELECTRON MICROSCOPIC AND MICRODIFFRACTION STUDY

Organic matter (OM) concentrates of carbonaceous siliceous Lower Visean shales, Tournaisian radiolarite and Bashkirian siliceous shales, as well as physicochemical weathering products of Lower Visean black shales of the Pai-Khoi have been studied.

Earlier, thermal analysis of organic matter of the schales under study showed the former to belong to semianthracite-anthracites with a minor portion of imperfect graphite. A study of the structure of OM and its comparison with that of ideal graphite (Table) demonstrated that the OM of black shales may be regarded as a carbonaceous matter with the rudiments of graphite structure or as a mixture of graphite-like and amorphous materials.

The microdiffraction pattern contains three reflexes at 3.37, 2.02 and 1.17 Å. A function of the radial distribution of atoms in the OM of Pai-Khoi black shales

has been calculated.

Morphologically OM is presented by globular-chain aggregates and each globule is in its turn an aggregate of spherical particles of 60 Å in diameter.

Amorphization of OM under the influence of electron irradiatio has been established.

Academy of Sciences of the USSR, Ural branch, Komi Scientific Centre Syktyvkar